

第5回 コスメ道場

第3回評価道場 皮膚計測講座

皮膚計測の基礎をしっかりと学んでみよう！

皮膚計測は化粧品の効果を測定するためには欠かせません。簡単にできそうで、実は簡単ではない皮膚計測を初歩から学んでいただくのが評価道場・皮膚計測講座。皮膚表面水分量、TEWL、皮膚粘弾性、皮脂量などの測定だけでなく、画像解析による肌測定の原理と測り方をしっかり講義します。今回は初めての東京開催です。

お申込み

<https://forms.gle/EVrp8nhxBkmDpEpD9>



共催	樟蔭美科学研究所 / 株式会社 CIEL コスメ道場事務局（株式会社ベルヴィーヌ）
対象者	皮膚計測初心者 しっかり基礎から学び直したい皮膚計測実務者
開催日	2024年3月29日（金）10時～17時
開催方式	対面（実習含む）
開催場所	DRC 株式会社 東京評価センター 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町 3-17 近仁ビル 1 階 https://drc-web.co.jp/access/ 上記 URL 内の「東京評価センター」をご覧ください。
定員	10 名程度
参加費	33,000 円（税込） / 1 名
講師	●岡野 由利 氏 株式会社 CIEL 取締役 博士（薬学） ●井筒 ゆき子 氏 株式会社 CIEL リサーチャー ●高野 雅史 氏 DRC 株式会社 経営企画室 部長 ●吉田 悠真 氏 DRC 株式会社 化粧品・食品有用性試験グループ 課長
講義内容	午前中：講義 午後：実習 皮膚表面水分量、TEWL、セブメーター、キュートメーター、そして現在広く活用されている顔画像診断装置 VISIA を使いこなせるようになっていただきます。 ・それぞれの機器の原理を学ぶ ・安定した測定値を出すためのコツを学ぶ ・各種機器の特徴と違いについて知る
協力	DRC 株式会社 https://drc-web.co.jp/
お問合せ先	コスメ道場事務局 cosmedojo@bellevienus.co.jp

コスメ道場
COSME DŌJŌ



樟蔭美科学研究所
Shoin Beauty Science Center